

RTTLIT P20 实时瞬态锁相热分析系统

RTTLIT Thermal Emission Microscopy System

RTTLIT实时瞬态锁相热分析系统(采用锁相热成像(Lock-in Thermography)技术，通过调制电信号提升特征分辨率与灵敏度，结合软件算法优化信噪比，以实现显微成像下的高灵敏度热信号测量。



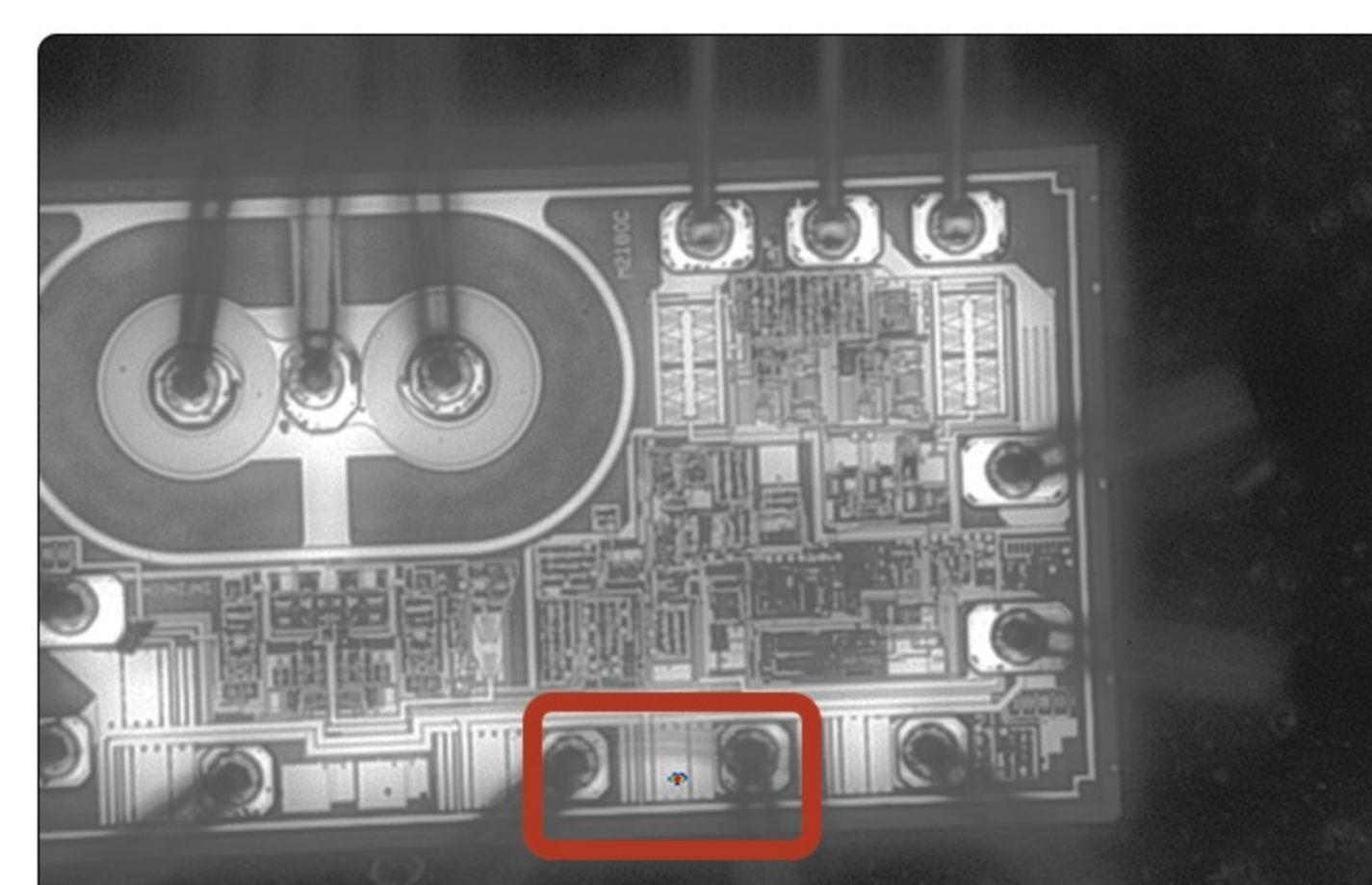
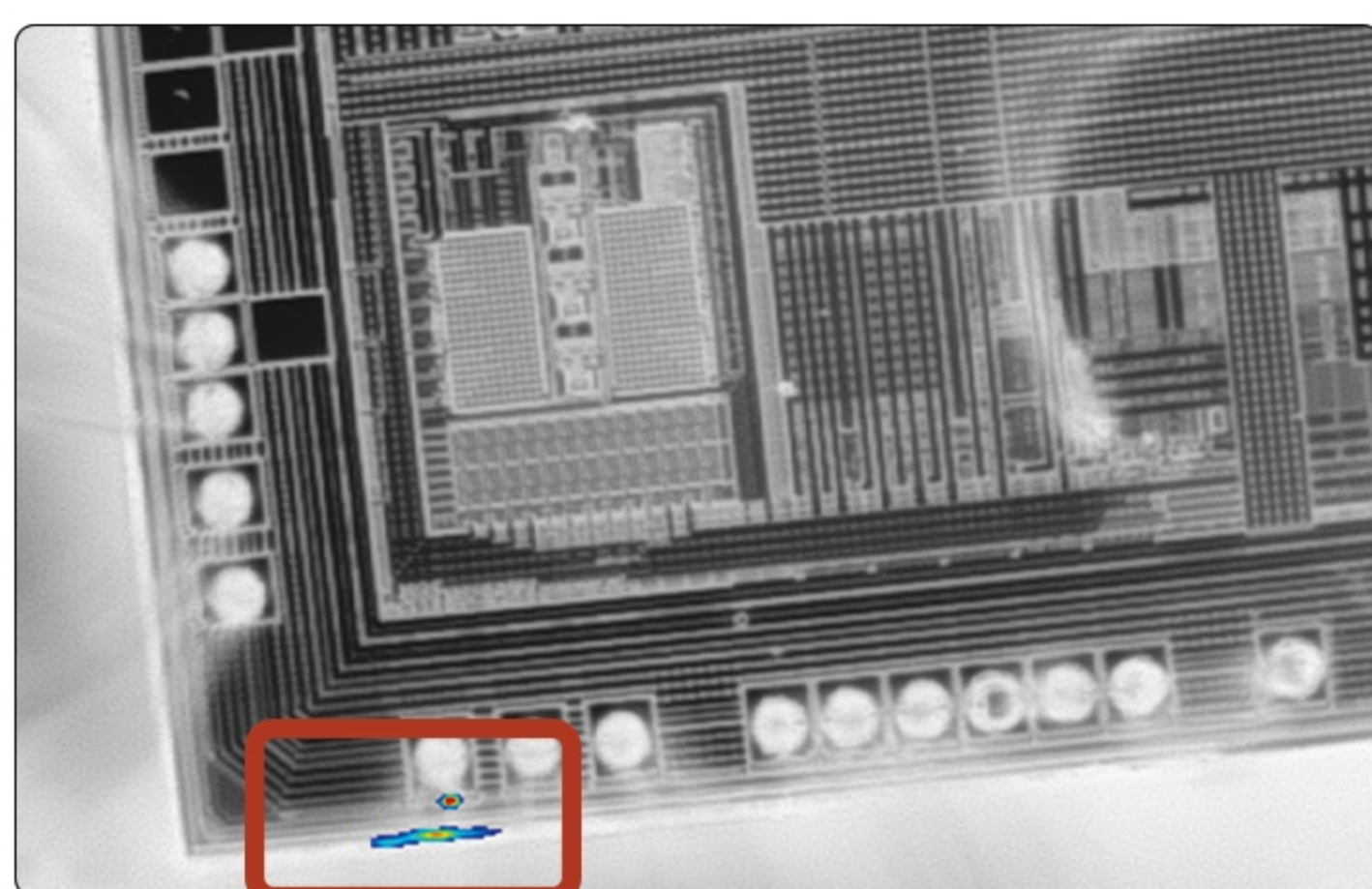
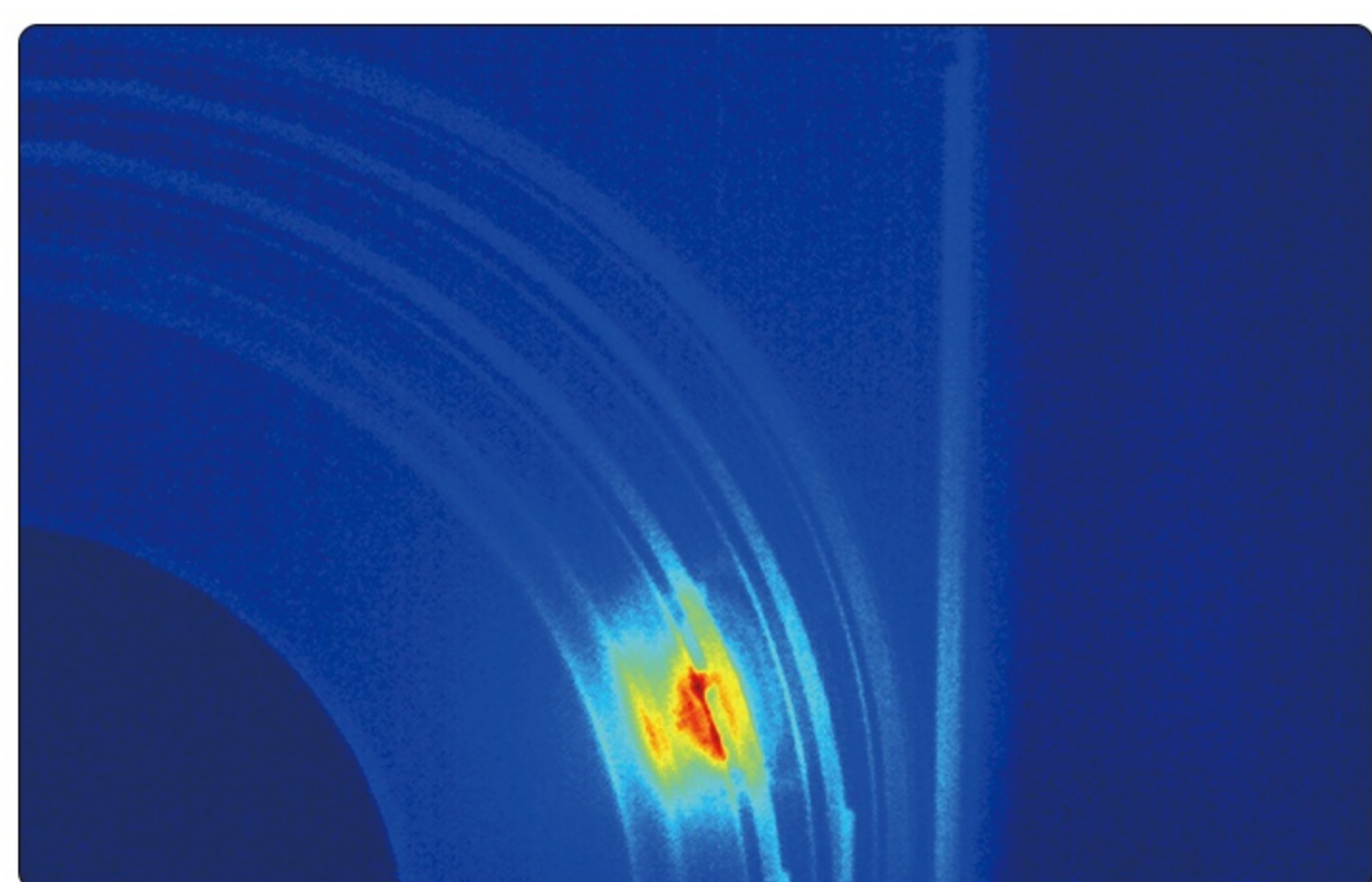
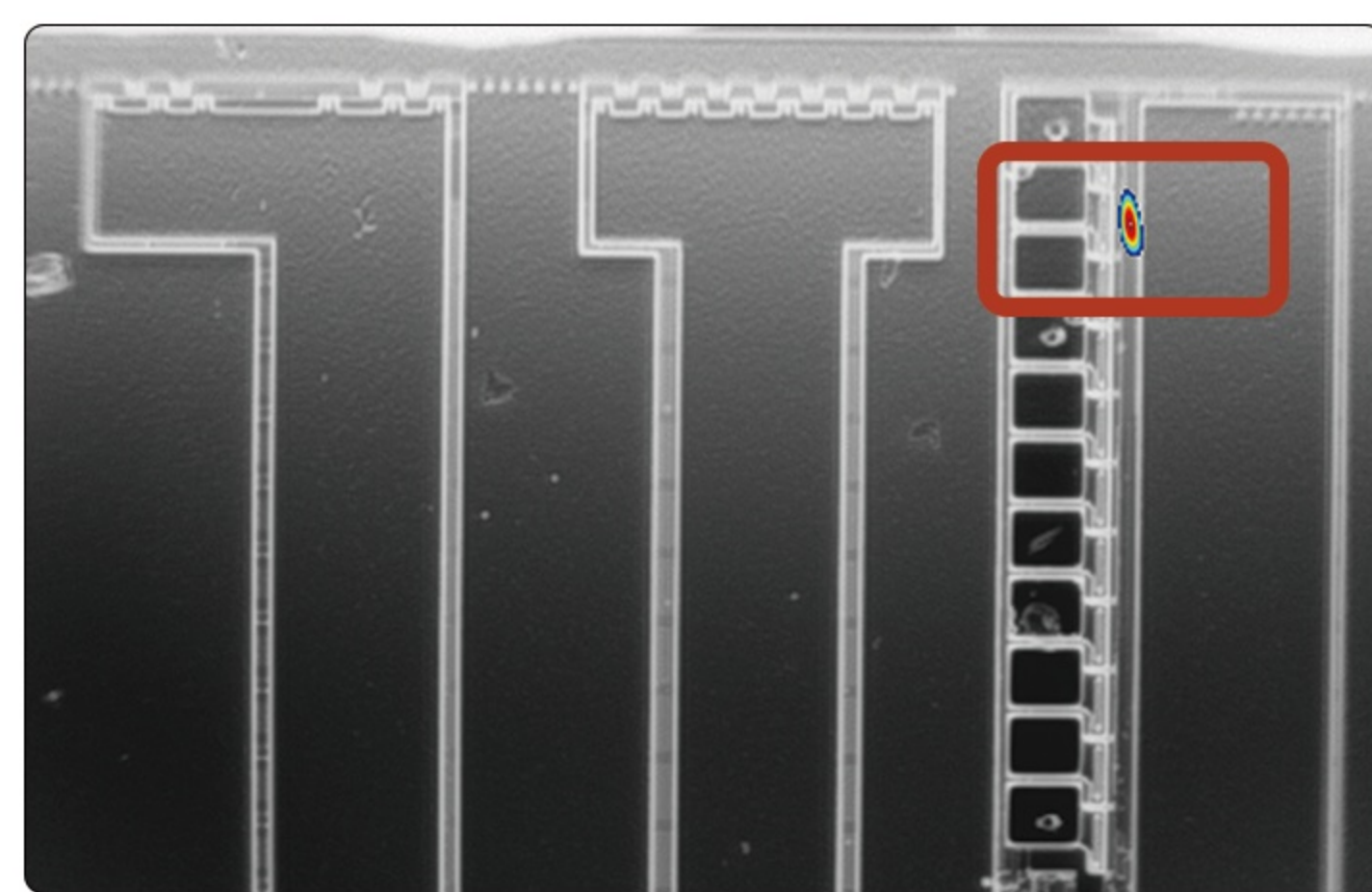
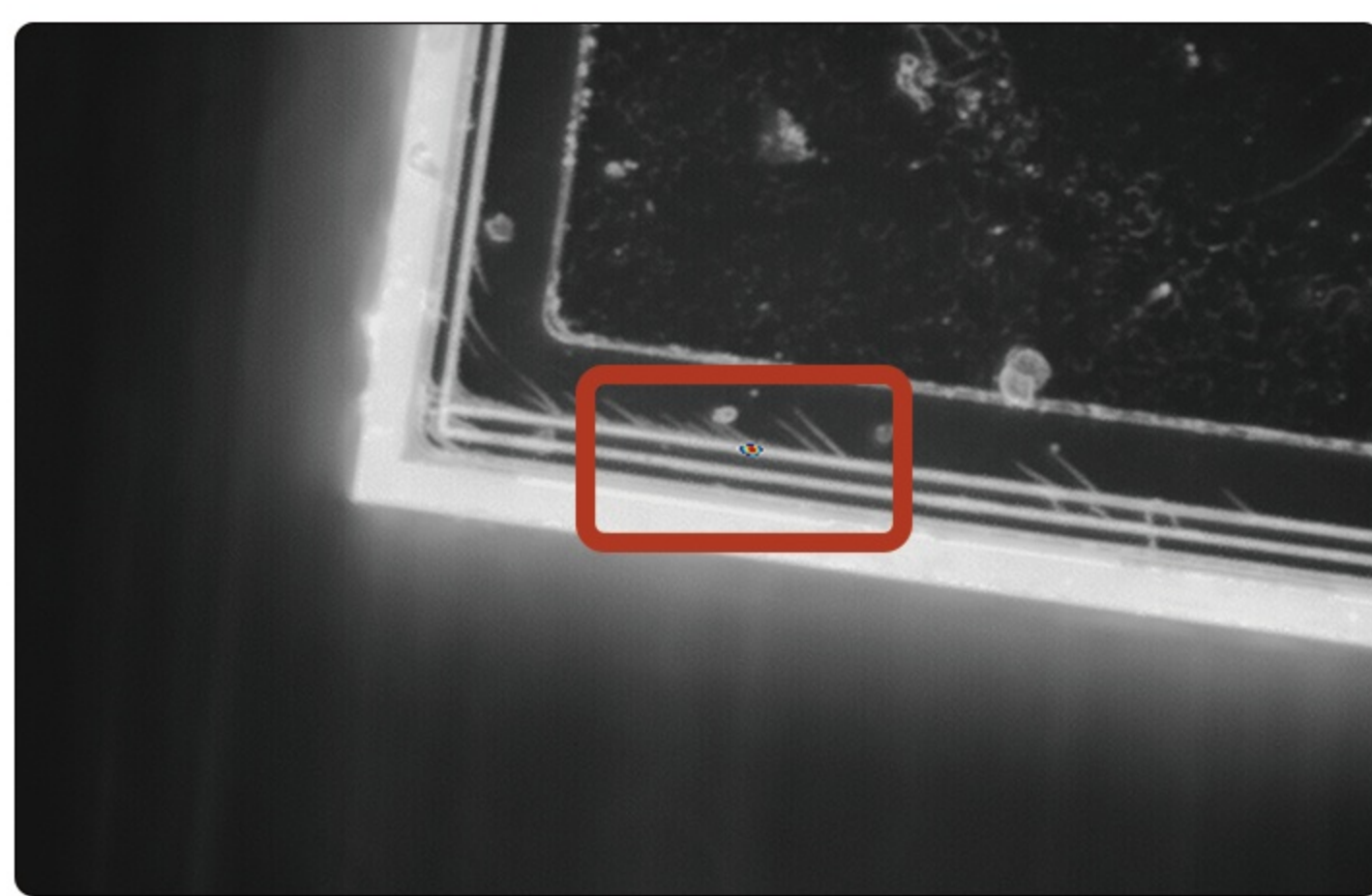
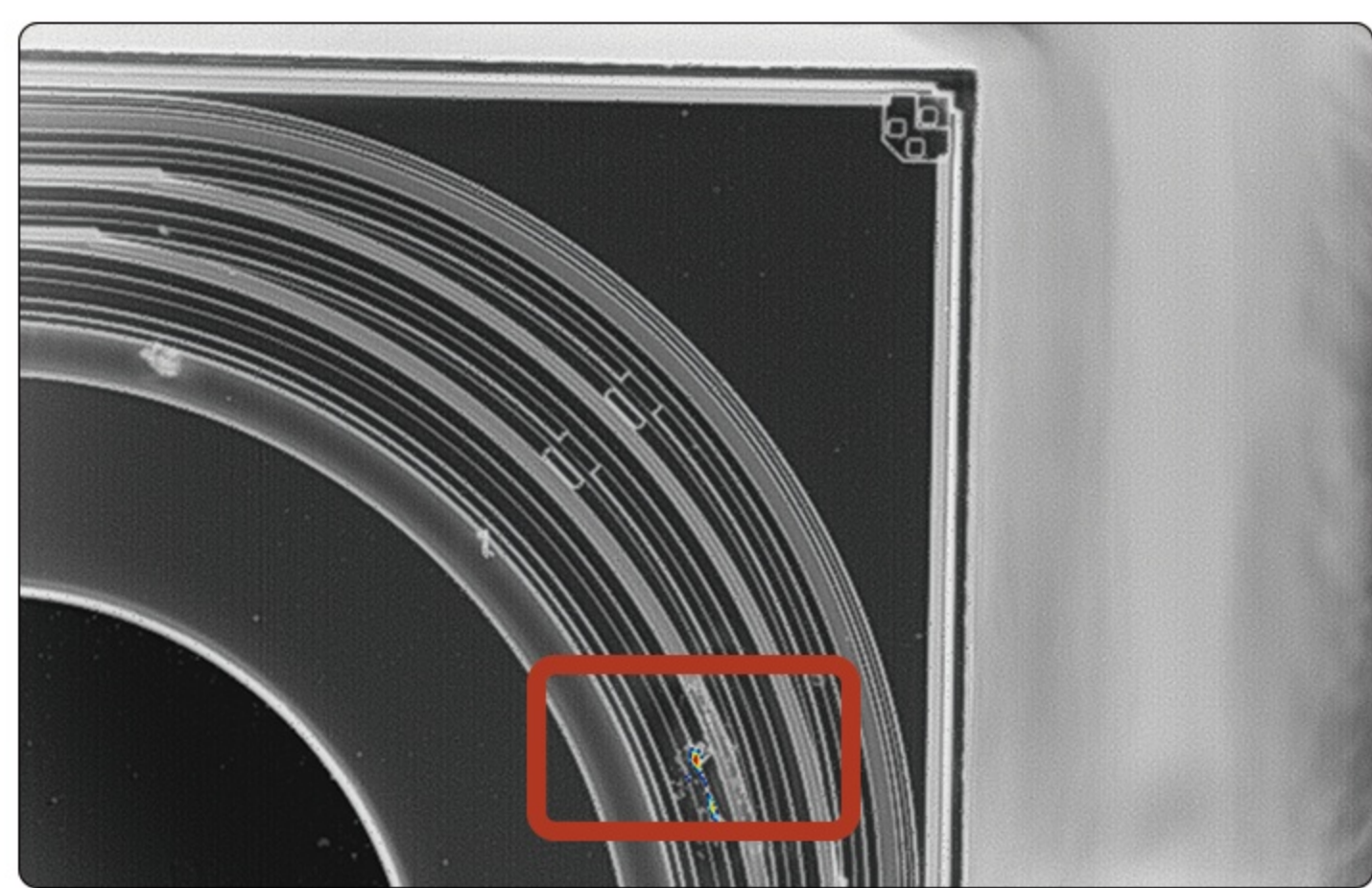
产品介绍

Product Introduction

RTTLIT P20采用100Hz高频深制冷型超高灵敏度显微热红外成像系统，测温灵敏度可达 0.0001°C ，显微分辨率低至 $2\mu\text{m}$ ；RTTLIT P20具备显著的检测灵敏度和测试能量；重点应用于半导体器件、晶圆、集成电路、IGBT、功率模块、第三代半导体、LED、microLED等对测温灵敏度和显微分辨率要求更高的失效分析场景，是电子及半导体失效分析和缺陷定位领域的重要关键工具。

案例展示

Case Presentation



设备参数	RTTLIT实时瞬态锁相热分析系统
品牌	Zansun（致晟光电）
型号	RTTLIT P20
探测器	探测器类型：InSb
	探测波长：3~5 μm
	制冷方式：斯特林制冷
	帧频: 100 Hz
	制冷机寿命：8000 小时
	分辨率：640 * 512
	NETD：16 mK
锁相测试	锁相灵敏度：0.0001℃
	锁相频率：0.001 Hz ~ 32 Hz
光学物镜	可选倍率:
	Micro 广角镜头
	0.13X ~ 0.3X 变焦镜头
	0.65X ~ 0.75X 变焦镜头
	3X ~ 4X 变焦镜头
	8X ~ 13X 变焦镜头
最小分辨率	2 μm



公众号

网 址： www.zansun.com

邮 箱： info@zansun.com

电 话： 400-666-8879

地 址： 苏州虎丘区湘江路创业街60号创捷科技园E幢1001-1004